



## 一种用于光电材料光致发光光谱辐射损伤的测试方法

郭旗<sup>\*</sup>; 玛丽娅·黑尼; 艾尔肯·阿不都瓦衣提; 李豫东<sup>\*</sup>; 文林<sup>\*</sup>; 周东<sup>\*</sup>; 张兴尧; 陆妩<sup>\*</sup>; 余学峰<sup>\*</sup>; 何承发<sup>\*</sup>

2017-02-01

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种用于光电材料光致发光光谱辐射损伤分析的测试方法,该方法中涉及装置是由激光器、第一凸透镜、斩波器、低温样品室、载样铜片、待测光电材料、第二凸透镜、第三凸透镜、光栅光谱仪、探测器、锁相放大器和记录仪组成,利用斩波器斩波的具有频率的非连续激光,经过凸透镜聚焦后打在待测光电材料中心位置,样品受激光激发后发出的光经凸透镜收集聚焦并投射入光栅光谱仪的狭缝入口,经光谱仪分光后经由光电探测器接受信号,并经过锁相放大器对信号进行降噪放大,所采集的不同信号得出光电材料的光致发光谱,再将光电材料受高能粒子辐照后,再进行测试一次,即可得到光电材料的光致发光光谱辐射损伤。该方法减轻了光电材料辐照前后光致发光谱测试的工作量;结构紧凑,操作简单方便。

申请日期

2016-08-25

申请号

CN201610720572.6

公开(公告)号

CN106370629A

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/6557

专题

材料物理与化学研究室  
固体辐射物理研究室

推荐引用方式

GB/T 7714

郭旗,玛丽娅·黑尼,艾尔肯·阿不都瓦衣提,等.一种用于光电材料光致发光光谱辐射损伤的测试方法. CN106370629A[P]. 2017-02-01.



## 条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

## 个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

📊 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

## 谷歌学术

📖 谷歌学术中相似的文章

📖 [郭旗]的文章

📖 [玛丽娅·黑尼]的文章

📖 [艾尔肯·阿不都瓦衣提]的文章

## 百度学术

📖 百度学术中相似的文章

📖 [郭旗]的文章

📖 [玛丽娅·黑尼]的文章

📖 [艾尔肯·阿不都瓦衣提]的文章

## 必应学术

📖 必应学术中相似的文章

📖 [郭旗]的文章

📖 [玛丽娅·黑尼]的文章

📖 [艾尔肯·阿不都瓦衣提]的文章

## 相关权益政策

暂无数据

暂无数据

## 收藏/分享



QQ客服



官方微博



反馈留言